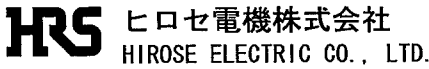


△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適 用 規 格									
定 格	使用温度範囲	-55℃ ～ 85℃ (注1)			保存温度範囲	-10℃ ～ 60℃ (注2)			
	電 圧	AC 125 V			使用湿度範囲	40 % ～ 80 %			
	電 流	0.5 A			保存湿度範囲	40 % ～ 70 % (注2)			
性 能									
	項 目	試 験 方 法			規 格			QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			45 mΩ以下			○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。			55 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。			100 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 全振幅 1.52 mm, 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 10→15 → 30→ 10→15 分 を 5 サイクル試験する。						○	—
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下			○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間			外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。			○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	—
はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃, 浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	—	
備考					製 図	担 当	検 図	承 認	出 図
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。									
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
					製品規格表				
					製品名 FX2C1-**P-1.27DSA(71)				
旧CL CL			図番 SLC4-083047-21			製品コード CL572			1 1